

PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:				
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy YES	Attached? NO
091119723	Taiwan, R.O.C.	08/29/2002		~	
		-			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

PTO/SB/21 (08-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

		Application Number	10/604,833	
5001		Filing Date	08/20/2003	
		First Named Invento	, Shih-Hong Liao	
(to be used for all cor	respondence after initial filing)	Group Art Unit		
		Examiner Name		
Total Number of Pages in This Submission 3 Attorney Docket Number ADTP0039USA				
	ENCL	OSURES (chec	ck all that apply)	
Fee Transmittal Form Fee Attached	Assignm (for an A	nent Papers A <i>pplication)</i> g(s)	After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences	
Amendment / Reply After Final Affidavits/declara Extension of Time Reque Express Abandonment F Information Disclosure S Certified Copy of Priority Document(s) Response to Missing Pa Incomplete Application Response to Miss under 37 CFR 1.5	Petition Petition Provisio Power of Change Address Termina Request Request Tetrina Request Remarks	to Convert to a onal Application of Attorney, Revocation of Correspondence	Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):	
	SIGNATURE OF APPLI	ICANT, ATTORNEY, O	R AGENT	
Firm or W Individual name	or Winston Hsu, Reg. No.: 41,526			
Signature	Winn	Ton Ha	1/	
Date				
	CERTIFIC	ATE OF MAILING		
	ondence is being deposited with the commissioner for Patents, War		ervice with sufficient postage as first class is date:	
Typed or printed name				
Signature) _E	Date	

	CERTIFICATE OF MAILING	3	
	ndence is being deposited with the United States Post Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 o		
Typed or printed name			
Signature		Date	

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

OIPE CARAGEMENT SERVICE TRADEMENTS

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

FEE TRANSMITTAL for FY 2003

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00

porta to a collection of him	of that of the control that the control that the		
Complete if Known			
Application Number	10/604,833		
Filing Date	8/20/2003		
First Named Inventor	Shih-Hong Liao		
Examiner Name			
Art Unit			
Attorney Docket No.	ADTP0039USA		

METHOD OF PAYMENT (check all that apply) FEE CALCULATION (continued)	FEE CALCULATION (continued)			
Check Credit card Money Other None 3. ADDITIONAL FEES				
Penosit Account:				
Deposit 50 0004 Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fee Fe	Fee Paid			
Account Number 50-0801 1051 130 2051 65 Surcharge - late filing fee or oath				
Deposit Account North America International Patent Office 1052 50 2052 25 Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet				
Name 1053 130 Non-English specification 1053 130 Non-English specification				
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments 1812 2,520 For filling a request for ex parte reexamination				
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application				
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee 1805 1,840* Requesting publication of SIR after Examiner action				
1251 110 2251 55 Extension for reply within first month	<u> </u>			
FEE CALCULATION 1252 410 2252 205 Extension for reply within second month				
1. BASIC FILING FEE Large Entity Small Entity 1253 930 2253 465 Extension for reply within third month				
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid 1254 1,450 2254 725 Extension for reply within fourth month				
1001 750 2001 375 Utility filing fee 1255 1,970 2255 985 Extension for reply within fifth month	1			
1002 330 2002 165 Design filing fee 1401 320 2401 160 Notice of Appeal				
1003 520 2003 260 Plant filing fee 1402 320 2402 160 Filing a brief in support of an appeal	<u> </u>			
1004 750 2004 375 Reissue filing fee 1403 280 2403 140 Request for oral hearing				
1005 160 2005 80 Provisional filing fee 1451 1,510 1451 1,510 Petition to institute a public use proceeding				
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00 1452 110 2452 55 Petition to revive - unavoidable				
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE				
Fee from 1301 1,300 2301 030 Unity Isade fee (of reisade)				
Total Claims				
Independent 344 - XX				
Multiple Dependent				
Large Entity Small Entity Small Entity 1807 1807 1806 180 1808 1809				
Fee Fee Fee Fee Description Code (\$) Code (\$) Recording each patent assignment per				
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20				
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))				
1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid 1810 750 2810 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))				
1204 84 2204 42 **Reissue independent claims over original patent 1801 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE)				
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1802 900 Request for expedited examination of a design application				
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00 Other fee (specify)	- //			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above *Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00)			

SUBMITTED BY

Name (Print/Type) Winston Hsu

Registration No. (Altorney/Agent) 41,526

Telephone 886289237350

Signature

Date

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



25 25 25 25



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2002 年 08 月 29 日

Application Date

申 請 案 號: 091119723 <>

Application No.

申 請 人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

長

Director General



發文日期: 西元 2002 年 10 月 25 日

Issue Date

發文字號: 09111020885

Serial No.



申	請	日	期	:

(以上各欄由本局填註)

申請日期:	大大大学
類別:	
(以上夕烟上十尺坊计)	

		發明專利說明書
	中文	製作一液晶顯示面板的方法
、 發明名稱	英文	METHOD OF FABRICATING A LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL
	姓 名 (中文)	1. 廖世宏 2. 張彦中 3. 廖英智
二 發明人	姓 名 (英文)	1. Liao, Shih-Hong 2. Chang, Yen-Chung 3. Liao, Ying-Jyh
	國 籍	1. 中華民國 2. 中華民國 3. 中華民國
	住、居所	1. 高雄市楠梓區仁昌里惠民路一0三號 2. 桃園縣龍潭鄉民族路二七八巷八十八弄三衖十五號二樓 3. 台北縣三重市忠孝路三段五十巷九十二號三樓
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1. AU Optronics Corp.
	國 籍	1. 中華民國
(□) / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ /	住、居所 (事務所)	
	代表人 姓 名 (中文)	1. 李焜耀
	代表人 姓 名 (英文)	1. Lee, Kuen-Yao
	代姓(中 大名) 代姓(中 大名)	1. 李焜耀



四、中文發明摘要 (發明之名稱:製作一液晶顯示面板的方法)

英文發明摘要 (發明之名稱:METHOD OF FABRICATING A LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL)

A method of fabricating a liquid crystal display (LCD) panel is provided. The LCD includes a first substrate positioned on an upper stage in vacuum chamber, and a second substrate positioned on a lower stage in the vacuum chamber. A predetermined gap is remained between the first substrate and the second substrate. The method includes vacuuming the vacuum chamber and horizontally aligning the first substrate with the second substrate. Following that, a first affixing





四、中文發明摘要 (發明之名稱:製作一液晶顯示面板的方法)

英文發明摘要 (發明之名稱: METHOD OF FABRICATING A LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL)

process is performed to press a first portion of the first substrate on at least a dummy sealant on the second substrate. A second affixing process is then performed to press a second portion of the first substrate on a main sealant on the second substrate, thus completing combination of the first substrate and the second substrate.



(; ;

本案已向 案號 申請日期 國(地區)申請專利 、張優先權 無 寄存號碼 寄存日期 有關微生物已寄存於 無

第4頁

.

....

•••

五、發明說明 (1)

發明之領域

本發明係提供一種製作一液晶顯示面板的方法,尤指一種組裝一液晶顯示面板之上基板與下基板的方法。

背景說明

請參考圖一至圖三,圖一至圖三為習知利用ODF技術製作一液晶顯示面板的方法示意圖。如圖一所示,習知方





五、發明說明 (2)

法於製作液晶顯示面板時,通常係先提供一具有特定尺寸 的基板 10,例如玻璃基板或塑膠基板等,並於基板 10之一 實際利用區域 12中定義複數個顯示面板 14之圖案 製作液晶顯示面板之下基板顯示元件,該下基板可為一薄 膜電晶體基板,包括排列成陣列的薄膜電晶體、像素電極 (pixel electrode)、掃瞄線 (scan or gate line)以及訊 號線(data or signal line)等,進一步,該下基板亦可 為 — COA(color filter on array)基 板 或 是 — AOC(array on color filter)基板,亦即包含一彩色濾光層、排列成 陣列的薄膜電晶體、像素電極 (pixel electrode)、掃瞄 💹 (scan or gate line)以及訊號線 (data or signal line)等其中,若該下基板為 COA基板,則該彩色濾光層係 設置於該薄膜電晶體之上方,而若該下基板為 AOC基板, 則該彩色濾光層係設置於該薄膜電晶體之下方,且基板 10 表面覆蓋有一包含有配向圖案的配向層(orientation layer), 以及複數個間隙劑(spacer)設於配向層表面。接 下來於基板 10之實際利用區域 12外的邊框區域塗佈一膠層 16。 然 後 利 用 注 射 筒 或 噴 墨 (ink jet)的 原 理 , 以 氣 壓 伺服馬達或其他類似的方式將液晶滴於基板 10表面,並將 基板 10與另一其上包含有上基板顯示元件的基板(例如玻 疹。或塑膠基板)送至一腔體內,以提供適當機械壓力及大 氣 壓 力 使 兩 塊 基 板 壓 合 , 當 該 下 基 板 為 一 般 的 薄 膜 電 晶 體 基板時,該上基板係為一彩色濾光基板,但當該下基板為 COA基板或 AOC基板時,則該上基板係為一玻璃或塑膠基





五、發明說明(3)

板,同時利用間隙劑於上基板與下基板之間留下可供液晶分子存在之間距。最後將組合後的兩塊基板進行適當切割,並配以外部電路之連接測試,即完成各個液晶顯示面板之製作。

随後,於腔體 20內抽真空,並使上基板 26與下基板 28 之間維持一間距 d1,以開始進行上基板 26與下基板 28之間 之水平對位。待對位完畢後,如圖三所示,再利用一驅動 裝置 38於上承載台 22背面提供一機械性應力,使上基板 26





五、發明說明(4)

持續下降直至與下基板 28表面之膠層 30相接觸,並確保上基板 26與下基板 28之邊框區域已緊密接合而無縫隙。之後,解除腔體內 20的真空狀態,並使腔體內 20的氣壓回復到大氣壓,以使設於上基板 26、下基板 28之間的液晶 34散開,形成一均匀分布的液晶層。最後將上基板 26與下基板 28段 出腔體 20,利用 UV曝光機、熱烤爐或結合 UV曝光機與熱烤爐二種或其他硬化方式來對膠層 30進行一硬化處理,以使膠層 30硬化,完成上基板 26與下基板 28之組裝。

發明概述

因此,本發明之目的即在提供一種製作一液晶顯示面板的方法,以避免上述問題。





五、發明說明 (5)

發明之詳細說明

請參考圖四至圖九,圖四至圖九為本發明之第一實施





五、發明說明 (6)

例之粗装一液晶顯示面板之上基板與下基板的方法示意。 如圖四所示,本發明係先將一上基板 46以及一下基板 48分 別置於一腔體 40內之一上承載台 42表面以及一下承載台 44 表 面 。 下 基 板 48表 面 包 含 有 複 數 個 液 晶 滴 54、 間 隙 劑 56以 及其他顯示元件等,設於下基板48中央之實際利用區域, 一主膠層 52環繞於實際利用區域外側之下基板 48表面,以 及至少一次膠層 50環繞於液晶滴 54、間隙劑 56以及主膠層 5 2 外 側 之 下 基 板 4 8 表 面 。 上 基 板 4 6 表 面 定 義 有 一 中 央 部 分,用來設置濾光片、黑色矩陣、透明電極以及配向圖案 等顯示元件,以及一邊框部分46a,用來塗設次膠層或與 型設於下基板48表面之次膠層50黏貼。於本發明中,該主 膠 層 52、 次 膠 層 50及 間 隙 劑 56並 不 限 於 設 置 於 該 下 基 板 48 上,亦可視製程需求而分別設置於該上基板46上。此外, 上承載台 42亦包含有一連接至一驅動裝置60之第一部分 42a、42b、用來承載上基板 46之邊框部分 46a以及一連接 至一驅動裝置58之第二部分,用來承載上基板46設有顯示 元件之中央部份。

上承載台 42與下承載台 44係可利用真空吸附、靜電盤吸附或提供適當的摩擦力來支撐上基板 46與下基板 48, 且中上基板 46表面之配向圖案須翻轉至與下基板 48表面之配向圖案上、下相對,以控制液晶分子的排列方向。值得注意的是,由於主膠層 52之功用係在於保護液晶滴 54, 避免液晶滴 54與外界接觸,而次膠層 50之功用則在加強液晶





五、發明說明 (7)

商 5 4與外界之隔離,以完全避免大氣渗透至填充液晶區域,因此主膠層 5 2與次膠層 5 0之塗佈方式以及數量可以依照隔絕效果作最適化之調整。如圖五所示,在本發明之較佳實施例中,下基板 4 8表面已定義有複數個顯示面板 4 9之圖案,該下基板 4 8之材質例如玻璃或塑膠,而主膠層 5 2係環繞於複數個顯示面板 4 9圖案之外側,次膠層 5 0係環繞於主膠層 5 2外側。

隨後,如圖六與圖七所示,於腔體 40內抽真空,並且利用驅動裝置 58、60將整個上承載台 42降下,使上基板 46下基板 48之間維持一約為數百微米之間距 d2,例如 d2約介於 50至 500微米之間,以開始進行上基板 46與下基板 48之間之水平對位。待對位完畢後,如圖八所示,再進行一第一壓合製程,利用驅動裝置 60於上承載台 42之第一部份 42a、42b背面提供一機械性應力,使上基板 46之邊框部分 46a持續下降直至與下基板 48表面之次膠層 50相接觸,例如以下降距離或施加壓力作為驅動裝置 60之控制參數,以確保上基板 46之邊框部分 46a與下基板 48之邊框部分已緊密接合而無縫隙,避免後續開放大氣時,空氣滲入液晶填充區域。隨後,進行硬化過程,使該次膠層 50部分區域硬充區域。隨後,進行硬化過程,使該次膠層 50部分區域硬充區域。隨後,進行硬化過程,使該次膠層 50部分區域硬充區域。隨後,進行硬化過程,使該次膠層 50部分區域硬充區域。隨後,進行硬化過程,使該次膠層 50部分區域

之後,如圖九所示,進行一第二壓合製程,先解除上





五、發明說明 (8)

由於本發明係僅利用機械應力來壓合次膠層 50區域, 因此可以避免習知於液晶填充區域施加機械應力所導致之 間距缺陷,而且即使微粒或玻璃碎屑掉落於上承載台 42之 第一部份 42a與 42b以及支撐次膠層 50區域之下承載台 44表 面,亦僅會在上、下基板之邊框區域形成間距缺陷,而不 會對液晶顯示面板之實際利用區域 (顯示區域)造成影響。

請參考圖十至圖十四,圖十至圖十四為本發明之第二實施例之組裝一液晶顯示面板之上基板與下基板的方法示意。如圖十所示,本發明係先將一上基板 76以及一下基板 78分別置於一腔體 70內之一上承載台 72表面以及一下承載





五、發明說明 (9)

台74表面。下基板78表面定義有一中央部分,用來設置複數個海晶滴54、間隙劑56等顯示元件以及一主膠層82環繞於海晶滴84、間隙劑86外側,此外下基板78表面亦定義有一次膠層80,於本發明中,該個框部分78a,用來塗設一次膠層80,於本發明中,16表面則定義有一中央部分,用來設置地板76表面則定義有一中央部分,用來設置上基板76表面則定義有一中央需要等於下基板78表面片、選個部分,用來塗設於下基板78表面與塗設於下基板78表一次膠層80黏貼。在此實施例中,上承載台72係連接至90之次膠層80黏貼。在此實施例中,上承載台74則包含有一連接至驅動裝置88,而下承載台74則包含有一連接至驅動裝置30之二部分74a、74b,用來承載下基板78之邊框部分78a。

上承載台72與下承載台74係可利用真空吸附、靜電盤吸附或提供適當的摩擦力來支撑上基板76與下基板78,且其中上基板76表面之配向圖案須翻轉至與下基板78表面之配向圖案上、下相對,以控制液晶分子的排列方向。值得注意的是,由於主膠層82之功用係在於保護液晶滴84,避免液晶滴84與外界接觸,而次膠層80之功用則在加強流晶為4與外界之隔離,以完全避免大氣渗透至填充液晶區域,因此主膠層82與次膠層80之塗佈方式以及數量可以依

隨後,如圖十一與圖十二所示,於腔體 70內抽真空, 並且利用驅動裝置 88將整個上承載台 72降下至上基板 76與





五、發明說明 (10)

下基板 78之間維持一約為數百微米之間距 d3,例如 d3約介於 50至 500微米之間,以開始進行上基板 76與下基板 78之間之水平對位。待對位完畢後,如圖十三所示,再進行一第一壓合製程,利用驅動裝置 90於下承載台 74之第二部份 74a、 74b背面提供一機械性應力,使下基板 78之邊框部分 78a持續上升直至上基板 76與次膠層 80相接觸,例如以上升距離或施加壓力作為驅動裝置 90之控制參數,以確保上基板 76之邊框部分 78a已緊密接合而無縫隙,避免後續開放大氣時,空氣滲入液晶填充區域。隨後,進行一次膠層 固化製程,利用一 UV曝光機照射過 180,以使次膠層 80,以硬化固定。

之後,如圖十四所示,進行一第二壓合製程,先解除上承載台72對上基板76之吸附力,以釋放上基板76之中央部分自然地垂直降下直至與大板78上之主膠層82相接觸。隨後,調整腔體70內之壓力積定壓力值,例如於腔體70開放數個氣孔92使空氣壓之預定壓力值,例如於腔體2、凝過氣型,並利用20回復至一大氣壓之環境,並利用82、凝晶滴器4以及間隙 86,並於上基板76與下基板78之間維持一適當間以份數程,前述之次膠層固化製程亦可合併至本製程的供製程,前述之次膠層固化製程亦可合併至本製程,所供進行主膠層與次膠層之固化),利用一UV曝光機照射主膠層82,以使主膠層22,以使土膠層82子以硬化固定,完成上基板76與下基





五、發明說明 (11)

板 78之 組 裝。

進一步地,如圖十五所示,本發明可更包含一壓力加強膜 93,其係設置於一上基板 76相 對應於上承載台 72之一面或是下基板 78相 對應於下承載台 74之一面,且該壓力加強膜 93的邊緣具有一突起 94,且該突起 94係對應於該次膠層 80設置,藉此,當上下基板 76、 78壓合時,該壓力加強 93之突起 94可對次膠層 80施加較大的壓力,而不對主膠層 82內之區域施加壓力,來達到僅施壓於次膠層 80之目的。

由於本發明係僅利用機械應力來壓合次膠層 80,因此可以避免習知於液晶填充區域施加機械應力所導致之間距缺陷,而且即使微粒或玻璃碎屑掉落於上承載台 72之邊框區域以及支撐次膠層 80區域之下承載台 74之第一部份 74a與 74b表面,亦僅會在上、下基板之邊框區域形成間距缺陷,而不會對液晶顯示面板之實際利用區域 (顯示區域)造成影響。

(1)可以避免微粒或玻璃碎屑於液晶顯示面板之顯示區域造成間距缺陷。由於本發明係利用機械應力來壓合次膠層以及利用大氣壓力來壓合主膠層,因此可以完全





五、發明說明 (12)

避免液晶顯示面板設於鄰近主膠層周圍之其他顯示元件受到機械應力之施壓,而產生液晶滴填充區域之上、下基板表面凹陷以及上、下基板間距不均勻等缺陷。

- (2)上、下承載台的精度 (平整度及平行度)要求可放鬆。由於習知方法係利用整體機械式加壓來壓合上、下基板,因此上、下承載台的平整度是影響液晶顯示面板品質良率之關鍵。然而由於本發明之上、下承載台僅係用來支撐上、下基板,且唯一之機械加壓區僅在設置次膠層之區域,因此對於上、下承載台的平整度要求可以放鬆。
- (1)可避免間隙劑被壓碎。由於習知方法係利用整體機械式加壓來壓合上、下基板,因此附著於液晶填充區域之微粒可能壓迫間隙劑,導致間隙劑產生破碎或變形,並進而導致局部間距塌陷之缺陷。然而由於本發





五、發明說明 (13)

明無需全面性的機械加壓,因此間隙劑便不致因受到機械壓力之施壓,而產生破碎或變形等問題。

- (5)減少組裝上、下基板對於機械加壓機構的依賴性,以改善每一液晶顯示面板之間距差異性問題。由於本發明係利用恆常不變的大氣壓力來壓合上、下基板,因此可以有效改善每一液晶顯示面板之間距差異性問題。
- (6)次膠層之機械加壓機構可與膠層固化時所需之固定機構整合,以避免次膠層於未固化前因搬送或其他因素造成上、下基板之相對移動 (shift)。
- (8)確保次膠層已完全被壓扁,上、下基板之間無縫隙產生,以避免大氣滲透,提昇良率。由於習知方法可能受限於承載台平面之精度而使機械壓力無法均勻施加於次膠層上,因此導致次膠層與上、下基板之間產生縫隙。然而本發明唯一之機械加壓區僅在設置次膠層之區域,因此可以確保次膠層已完全被壓扁而無縫

隙,以避免大氣渗透,提昇良率。





五、發明說明 (14)

(9)主膠層與次膠層可使用兩種不同的 UV膠材料,以節省成本。由於習知 ODF製程使用之 UV膠成本較一般 UV膠或熱膠高許多,因此本發明可以使用不同的 UV膠材料來製作主膠層與次膠層,以節省成本,且由於本發明之主膠層與次膠層係使用不同的壓合方式,因此液晶顯示面板便不至於因主膠層與次膠層材質不同而影響整體均勻性。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵血範圍。



圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一至圖三為習知製作一液晶顯示面板的方法示意圖。

圖四至圖九為本發明之第一實施例之組裝一液晶顯示面板之上基板與下基板的方法示意圖。

圖十至圖十四本發明之第二實施例之組裝一液晶顯示面板之上基板與下基板的方法示意圖。

圖十五為本發明另包含一壓力加強膜以組裝一液晶顯示面板之上基板與下基板的示意圖。

圖示之符號說明

1 0	基 板	1 2	實際利用區域
1 4	顯示面板	1 6	膠 層
2 0	腔 體	22	上承載台
2 4	下承載台	26	上基板
28	下基板	3 0	膠 層
3 4	液晶滴	3 6	間隙劑
3 8	驅動裝置	4 0	腔 體
42 · 42a · 42b	上承載台	4 4	下承載台
46、46a	上基板	48	下基板
4 9	顯示面板	5 0	次 膠 層
5 2	主膠層	5 4	液晶滴



圖	式.	頯	單	說	明	
127	ンし	[a]	-	ت/ر ت	77	

5 6	間隙劑	58,60	驅動裝置
62	氣 孔	7 0	腔 體
7 2	上承載台		
74 · 74a · 74b	下承載台	7 6	上基板
78、 78a	下基板	8 0	次 膠 層
8 2	主膠層	8 4	液晶滴
8 6	間 隙 劑	88 • 90	驅動裝置
9 2	氣 孔	93	壓力加強膜
9 4	突 起		
d1 \ d2 \ d3	上、下基板之	間距	

1. 一種製作一液晶顯示面板的方法,該液晶顯示面板包含有一上基板置於一腔體之一上承載台表面,以及一下基板置於該腔體之一下承載台表面,且該上基板與該下基板之間具有一預定間距,該方法包含有下列步驟:

於該腔體內抽真空,並使該上基板與該下基板進行一水平對位;

進行一第一壓合製程,以使該上基板及下基板藉由至少一次膠層 (dummy sealant)壓合;以及

進行一第二壓合製程,以使該上基板及下基板進一步藉由至少一主膠層 (main sealant)加以壓合。

- 2. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該上基板包含有至少一配向圖案 (orientation pattern)設於該上基板相對應於該上承載台之另一表面。
- 3. 如申請專利範圍第 2項之方法,其中該下基板包含有至少一配向圖案設於上基板相對應於該下承載台之另一表面,且與上基板之配向圖案平行相對。
- 4. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該預定間距約介 50至500微米之間。
- 5. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該下基板表面更包含有複數個液晶滴與間隙劑 (spacer),且該主膠層係環





繞於該等液晶滴與該等間隙劑之外側。

- 6. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該主膠層及次膠層係設置於該下基板相對應於該上基板之一表面上。
- 7. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該主膠層及次膠層係設置於該上基板相對應於該下基板之一表面上。
- 8. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該次膠層係設於該主膠層之外側。
- 9. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第一壓合製程包含有下列步驟:

提供一機械應力使該上承載台下降,直至該上承載台所承載之該上基板藉由該次膠層與下基板緊密接合。

- 10. 如申請專利範圍第 9項之方法,其中該第一壓合製程進一步包含一固化製程 (curing),使該次膠層部分區域硬化。
- 1. 如申請專利範圍第9項之方法,其中該第一壓合製程進一步包含一固化製程,使該次膠層全面硬化。
- 12. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第二壓合製程



包含有下列步驟:

釋放該上承載台所承載之該上基板,以使該上基板垂直降下直至該上基板與該下基板均與該主膠層相接觸;以及調整該腔體內之壓力至一預定壓力值,以使該上基板與該下基板藉由該主膠層緊密接合。

- 13. 如申請專利範圍第 12項之方法,其中該第二壓合製程進一步包含一固化製程,使該主膠層及次膠層硬化。
- 14. 如申請專利範圍第12項之方法,其中該預定壓力值係一大氣壓。
- 15. 如申請專利範圍第 12項之方法,其中該第一壓合製程係利用一機械應力使該上承載台下降。
- 16. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該第二壓合製程包含有下列步驟:

調整該腔體內之壓力至一預定壓力值;

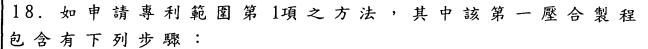
釋放該上承載台所承載之該上基板,以使該上基板利用該預定壓力值垂直降下直至該上基板緊密壓合至該主膠層;

進行一固化製程,以固化該次膠層以及該主膠層。

17. 如申請專利範圍第16項之方法,其中該預定壓力值係



為一大氣壓。



提供一機械應力使該下承載台上升,直至該下承載台所承載之該下基板藉由該次膠層與該上基板緊密壓合。

- 19. 如申請專利範圍第18項之方法,其中該第一壓合製程進一步包含一固化製程,使該次膠層之部分區域硬化。
- 進一步包含一固化製程,使該次膠層全面硬化。
- 21. 如申請專利範圍第 6項之方法,其中該第一壓合製程係利用一機械應力使該下承載台上升,直至該下承載台所承載之該下基板之該次膠層緊密壓合至該上基板。
- 22. 如申請專利範圍第21項之方法,其中該第二壓合製程包含有下列步驟:

調整該腔體內之壓力至一預定壓力值;

想放該上承載台所承載之該上基板,以使該上基板利用該預定壓力值垂直降下直至該上基板緊密壓合至該主膠層; 以及

進行一固化製程,以固化該次膠層以及該主膠層。



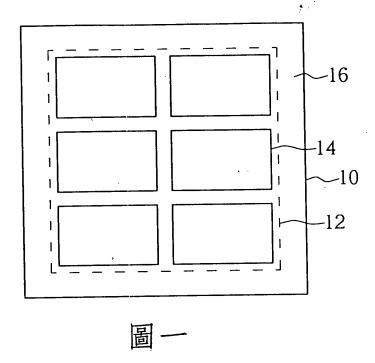
- 23. 如申請專利範圍第22項之方法,其中該預定壓力值係為一大氣壓。
- 24. 如申請專利範圍第1項之方法,進一步包含下列步驟:

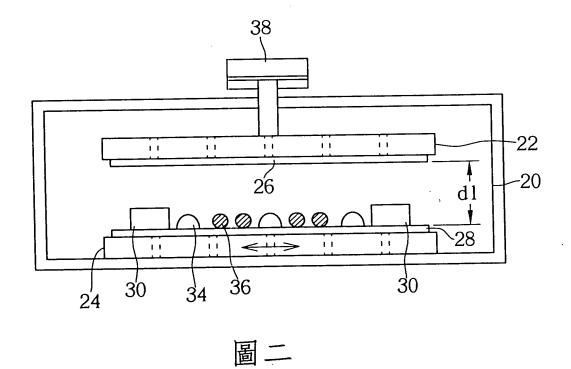
提供一壓力加強膜,設置於一上基板相對應於上承載台之一面,該壓力加強膜邊緣具有一突起,且該突起係對應於該主膠層及次膠層設置。

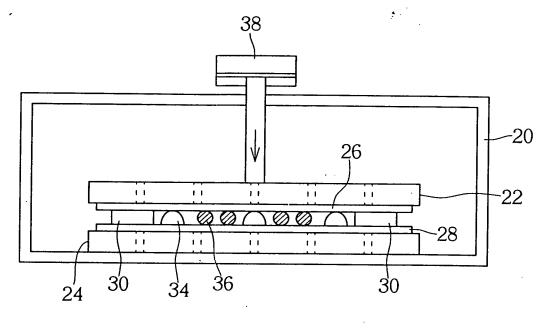
D. 如申請專利範圍第1項之方法,進一步包含下列步驟:

提供一壓力加強膜,設置於一下基板相對應於下承載台之一面,該壓力加強膜邊緣具有一突起,且該突起係對應於該主膠層及次膠層設置。









圖三

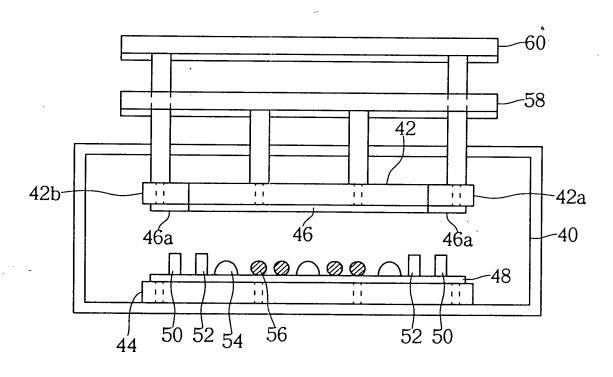
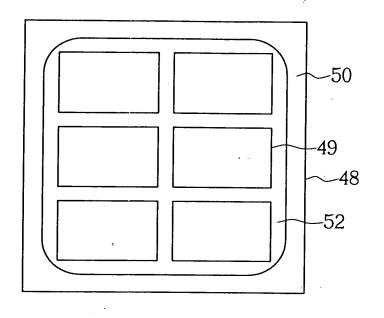
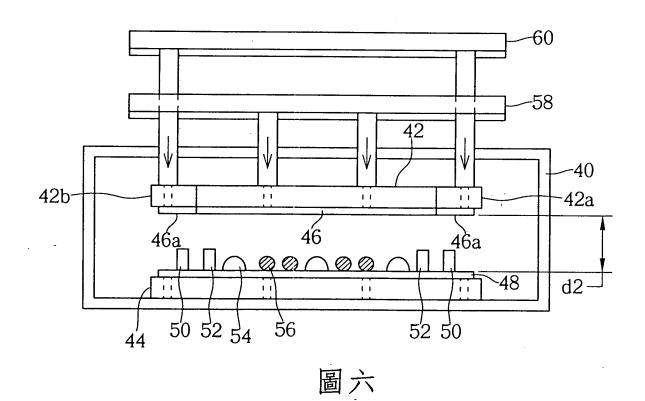


圖 四

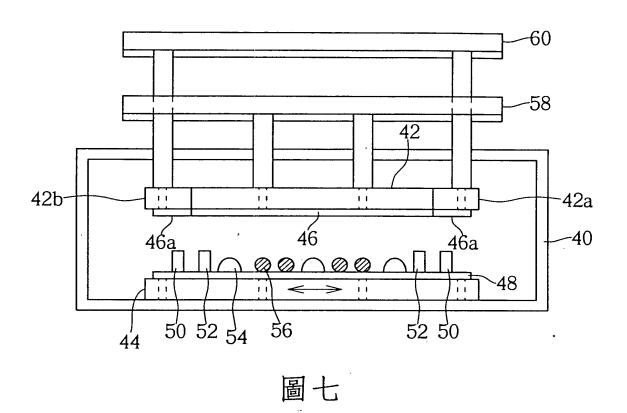


圖五

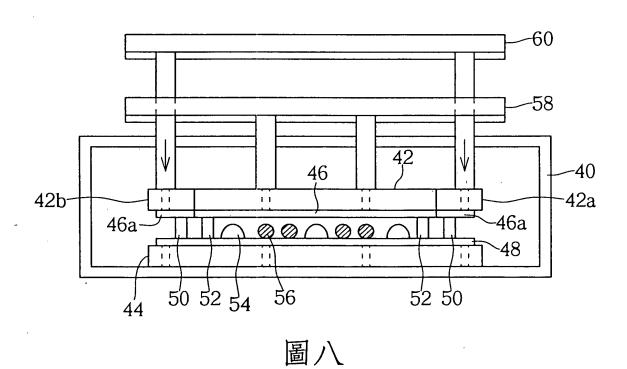
 C_{T}

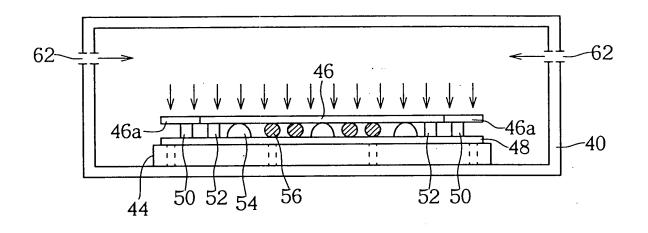




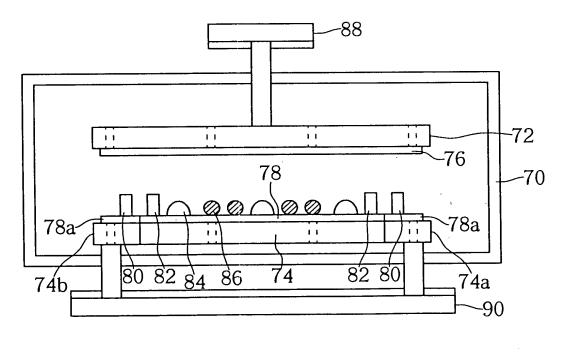


 $\langle \vec{e}, \vec{j} \rangle$



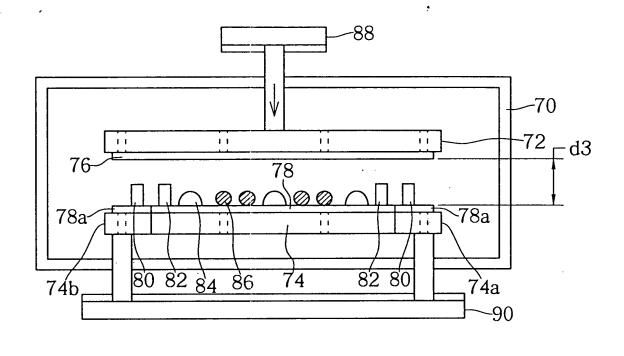


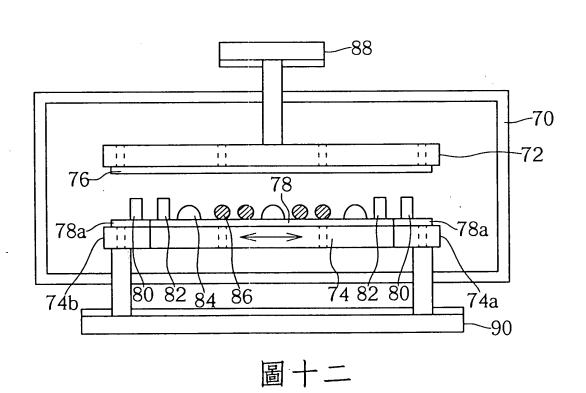
圖九

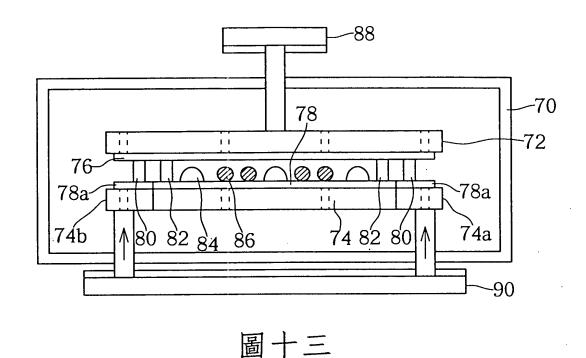


圖十



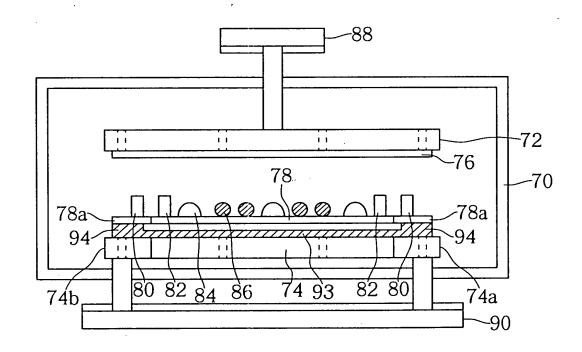






-70 7,8 -92 92--72 76-78a-00 ~78a 3 1 74a 74 80 82 84 82 80 74b 86 -90

圖十四



圖十五

